

	DIN EN 60904-7 (VDE 0126-4-7)	DIN
	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	VDE
ICS 27.160	Einsprüche bis 2007-06-30 Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 60904-7:1998-11 Entwurf Photovoltaische Einrichtungen – Teil 7: Berechnung der spektralen Fehlanpassungskorrektur für Messungen an photovoltaischen Einrichtungen (IEC 82/458/CDV:2006); Deutsche Fassung prEN 60904-7:2007 Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices (IEC 82/458/CDV:2006); German version prEN 60904-7:2007 Dispositifs photovoltaïques – Partie 7: Calcul de la correction de désadaptation des réponses spectrales dans les mesures de dispositifs photovoltaïques (CEI 82/458/CDV:2006); Version allemande prEN 60904-7:2007 Anwendungswarnvermerk Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren. Stellungnahmen werden erbeten – vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden – oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main. Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. Gesamtumfang 15 Seiten DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE	

– Entwurf –

E DIN EN 60904-7 (VDE 0126-4-7):2007-05

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europäischen Dokuments prEN 60904-7:2006 „Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices“ (Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale Dokument IEC 82/458/CDV:2006 „Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices“ unverändert in den Entwurf prEN 60904-7:2006 übernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgültig mit der Englischen und Französischen Fassung abgeglichen ist, ist die englische Originalfassung des IEC-CDV entsprechend der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 82 „Solar photovoltaic energy systems“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur „JA/NEIN“-Entscheidungen möglich, wobei „NEIN“-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen.

Für diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium K 373 „Photovoltaische Solarenergie-Systeme“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (<http://www.dke.de>) zuständig.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60904-7:1998-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt 2 „Zweck“ hinzugefügt;
- b) Abschnitt 4 „Beschreibung des Verfahrens“ vollständig überarbeitet;
- c) Abschnitt 5 „Prüfeinrichtung“ hinzugefügt;
- d) Abschnitt 6 „Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit“ hinzugefügt;
- e) Abschnitt 7 „Bestimmung des Prüfspektrums“ hinzugefügt;
- f) Abschnitt 8 „Bestimmung des spektralen Fehlanpassungsfaktors“ hinzugefügt.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN 60904-1 :1993	IEC 60904-1 :1987	DIN EN 60904-1 :1995-04	—
EN 60904-2 :1993 A1 :1998-04	IEC 60904-2 :1989 A1 :1998-02	DIN EN 60904-2 :1993 DIN EN 60904-2 :A1/1998-11	—
EN 60904-3 :1993	IEC 60904-3 :1989	DIN EN 60904-3 :1995-04	—
EN 60904-6 :1994 A1 :1998-04	IEC 60904-6 :1994 A1 :1998-02	DIN EN 60904-6 :1996-02 DIN EN 60904-6 :A1/1998-11	—
EN 60904-8 :1998	IEC 60904-8 :1998	DIN EN 60904-8 :1998-11	—
—	IEC 60904-9	—	—
EN 60904-10 :1998	IEC 60904-10 :1998	DIN EN 60904-10 :1998-11	—
EN 61215 :2005	IEC 61215 :2005	DIN EN 61215 (VDE 0126-31) :2006-02	VDE 0126-31
EN 61646 :1997	IEC 61646 :1996	DIN EN 61646 :1998-03	—

Nationaler Anhang NB (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60904-1: 1995-04, *Photovoltaische Einrichtungen - Teil 1: Messen der photovoltaischen Strom-/Spannungskennlinien* (IEC 60904-1:1987); Deutsche Fassung EN 60904-1:1993

DIN EN 60904-2/A1: 1998-11, *Photovoltaische Einrichtungen – Teil 2: Anforderungen an Referenz-Solarzellen – Änderung 1* (IEC 60904-2:1989/A1:1998); Deutsche Fassung EN 60904-2:1993/A1:1998

DIN EN 60904-3: 1995-04, *Photovoltaische Einrichtungen - Teil 3: Meßgrundsätze für terrestrische photovoltaische (PV) Einrichtungen mit Angaben über die spektrale Strahlungsverteilung* (IEC 60904-3:1989); Deutsche Fassung EN 60904-3:1993

DIN EN 60904-6/A1: 1998-11, *Photovoltaische Einrichtungen – Teil 6: Anforderungen an Referenz-Solarmodule – Änderung 1* (IEC 60904-6:1994/A1:1998); Deutsche Fassung EN 60904-6:1994/A1:1998

– Entwurf –

E DIN EN 60904-7 (VDE 0126-4-7):2007-05

DIN EN 60904-8: 1998-11, *Photovoltaische Einrichtungen - Teil 8: Messung der spektralen Empfindlichkeit einer photovoltaischen (PV) Einrichtung (IEC 60904-8:1998); Deutsche Fassung EN 60904-8:1998*

E DIN EN 60904-9 (VDE 0126-4-9): 2006-12, *Photovoltaische Einrichtungen - Teil 9: Leistungsanforderungen an Sonnensimulatoren (IEC 82/439/CDV:2006); Deutsche Fassung prEN 60904-9:2006*

DIN EN 60904-10: 1998-11, *Photovoltaische Einrichtungen - Teil 10: Meßverfahren für die Linearität (IEC 60904-10:1998); Deutsche Fassung EN 60904-10:1998*

DIN EN 61215 (VDE 0126-31): 2006-02, *Terrestrische kristalline Silicium-Photovoltaik-(PV-) Module - Bauartzeichnung und Bauartzulassung (IEC 61215:2005); Deutsche Fassung EN 61215:2005*

DIN EN 61646: 1998-03, *Terrestrische Dünnschicht-Photovoltaik- (PV) Module - Bauartzeichnung und Bauartzulassung (IEC 61646:1996); Deutsche Fassung EN 61646:1997*

**Photovoltaische Einrichtungen – Teil 7: Berechnung der spektralen
Fehlanpassungskorrektur für Messungen an photovoltaischen Einrichtungen**

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich.....	2
2 Zweck.....	2
3 Normative Verweisungen.....	2
4 Beschreibung des Verfahrens.....	3
5 Prüfeinrichtung.....	4
6 Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit.....	4
7 Bestimmung des Prüfspektrums.....	4
8 Bestimmung des spektralen Fehlanpassungsfaktors.....	5